

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05048213 A

(43) Date of publication of application: 26.02.93

(51) Int. CI

H01S 3/18 H01L 23/36 H01S 3/043

(21) Application number: 03229504

(71) Applicant:

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

(22) Date of filing: 15.08.91

(72) Inventor:

ISHIKURA CHIHARU

(54) SUB-MOUNT FOR SEMICONDUCTOR LASER

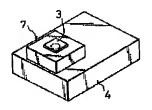
(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce manhours when assembling, by providing a through hole in a sub-mount, and by a semiconductor laser connecting electrically oscillation element with a heat sink, and further, by making bondings by wires and barrel coatings unnecessary.

CONSTITUTION: In a sub-mount 7 made of an insulation material, which is located between a semiconductor laser oscillation element 3 and a heat sink 4, a through hole 6 is provided. By the metallized layer formed on the inner surface of the through hole 6, the semiconductor laser oscillation element 3 makes continuity with the heat sink 4, which are provided respectively on both surfaces of the sub-mount 7. Thereby, bondings by wires are made unnecessary, and manhours when assembling are reduced, and further, the generations of faulty continuity caused by the disconnections of wires are eliminated. Also, on a machining process, a dicing-cut is performed in a final process. Therefore, machining can be treated in the state of an AIN base board, and it

is facilitated.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio



(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-48213

(43)公開日 平成5年(1993)2月26日

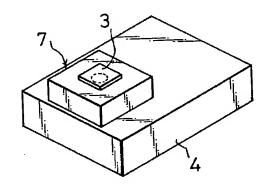
(51) Int. Cl. 5 H01S 3/18 H01L 23/36 H01S 3/043	識別記号	庁内整理番号 9170-4M	FI 技術表示箇所
		7220-4M 8934-4M	HO1L 23/36 D HO1S 3/04 S 審査請求 未請求 請求項の数1 (全4頁)
 (21)出願番号	特願平3-229504		(71)出願人 000217228 田中貴金属工業株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)8	月15日	東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番65 (72)発明者 石倉 千春 神奈川県伊勢原市鈴川26番地 田中貴金原工業株式会社伊勢原工場内

(54) 【発明の名称】半導体レーザーのサブマウント

(57)【要約】

【目的】 ワイヤーボンディングせず、またバレルコーティングせずに、レーザー発振素子とヒートシンクの導通をとることのできる半導体レーザーのサブマウントを提供する。

【構成】 半導体レーザー発振素子とヒートシンクと前 記両者の間に位置する絶縁材のサブマウントよりなる半 導体レーザーに於いて、前記サブマウントにスルホール を設け、このスルホールの内面にメタライズ層を形成し て、半導体レーザー発振素子とヒートシンクの導通をと ったことを特徴とする半導体レーザーのサブマウント。



【特許請求の範囲】

半導体レーザー発振素子とヒートシンク 【請求項1】 と前記両者の間に位置する絶縁材のサブマウントよりな る半導体レーザーに於いて、前記サブマウントにスルホ ールを設け、このスルホールの内面にメタライズ層を形 成して、半導体レーザー発振素子とヒートシンクの導通 をとったことを特徴とする半導体レーザーのサブマウン

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体レーザーの発振 素子を、Cu製で表面にAuめっきを施したヒートシン クにマウントする基板に係り、発振素子とヒートシンク 間の導電性と良好な熱伝導率を持ち合わせた機能を有す る半導体レーザーのサブマウントに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の半導体レーザーのサブマウントの 1つは、図6に示すA1N基板1の両面に、図7に示す ようにTi/Pt/Au又はCr/Ni/Au等をスパ ッタ法によりコーティングしてメタライズ層2を作り次 20 に図8に示すように所定のサイズにダイシングカットを 行った後、図9に示すように片面にレーザー発振素子3 を、他の片面にヒートシンク4を半田等によりボンディ ングしていた。そしてAlN基板1自体は導電性が無 く、周面はダイシングカットにより導通が無い為、レー ザー発振素子3側のA1N基板1のメタライズ層2とヒ ートシンク4の表面を図10に示すようにワイヤー5をボ ンディングして導通をとっていた。また、ワイヤーボン ディングしない従来の半導体レーザーのサブマウントの 他の1つは、図11に示すA1N基板1を図12に示すよう に所定のサイズにダイシングカットを行った後、スパッ タ法又は真空蒸着法によりTi/Pt/Auをバレルコ ーティングし、図13に示すようにサブマウント全周にメ タライズ層2を作り、次に図14に示すように片面にレー ザー発振素子3を、他の片面にヒートシンク4を半田等 によりボンディングして、メタライズ層2により導通を とっていた。

【0003】ところで、前者の場合は、ワイヤー5の断 線が生じることがあり、またワイヤー 5 をボンディング する為のスペースの確保が必要となる。ワイヤー5の断 40 線は信頼性を低下し、スペースの確保は小型化を阻害す ることとなる。また後者の場合は、AIN基板1のダイ シングカット後のバレルコーティングに手間がかかる。 しかもダイシングカットしたチップの洗浄、乾燥が必要 であり、またばらばらになったチップの取扱いが甚だ厄 介となる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、ワイ ヤーボンディングせず、またバレルコーティングせず に、レーザー発振素子とヒートシンクの導通をとること 50

のできる半導体レーザーのサブマウントを提供しようと するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため の本発明の半導体レーザーのサブマウントは、半導体レ ーザー発振素子とヒートシンクと前記両者の間に位置す る絶縁材のサブマウントよりなる半導体レーザーに於い て、前記サブマウントにスルホールを設け、このスルホ ールの内面にメタライズ層を形成して、半導体レーザー 10 発振素子とヒートシンクの導通をとったことを特徴とす るものである。

[0006]

【作用】上記のように本発明の半導体レーザーのサブマ ウントは、スルホールを設けて、このスルホール内面に 形成したメタライズ層により両面の半導体レーザー発振 素子とヒートシンクの導通をとっているので、ワイヤー によるボンディングが不要となり、組立時の工数削減及 びワイヤー断線による導通不良の発生が解消される。ま た加工工程上、最終工程でダイシングカットを行うこと となるので、最終までAIN基板の状態で取り扱うこと ができ、加工が容易となる。

[0007]

【実施例】本発明の半導体レーザーのサブマウントの一 実施例と従来例について説明する。先ず実施例について 説明すると、図1に示す長さ75mm、幅75mm、厚さ 0.3mm の鏡面仕上げ(表面粗さRa1000A程度)のAlN基板 1に、図2に示すようにレーザー加工にて直径 0.1mmの スルホール6を1㎜ピッチにて4900個穿設した。次に図 3に示すようにAIN基板1の表裏両面にRF 500W、 3分間のスパッタエッチングをした後にTi (1000Å) /Pt(3000Ă)/Au(2000Ă)をスパッタ法(DC 1 KW) によりコーティングしてメタライズ層 2 を形成 すると共にスルホール6の内面にもコーティングしてメ タライズ層2を形成して表裏両面の導通をとった。この 時のスパッタ処理は、Ti、Pt、Au夫々DC1KW であり、到達真空度 5 ×10⁻゚Torr、Arガス圧 3 × 10⁻³ Torrである。次いでこの表面及びスルホール6 の内面にメタライズ層2を形成したA1N基板1を、図 4 に示すようにダイサーにてスルホール 6 を 1 個ずつ中 心に据えて一辺 1.0mmの方形にカットしてサブマウント 7を作成した。このサブマウント7を図5に示すように ヒートシンク4の表面にAuSn20wt%の半田にてボン ディングし、サブマウント7の表面にレーザー発振素子 3をAuSn20wt%の半田にてボンディングした。

【0008】一方、従来例について説明すると、図6に 示す実施例と同一のA 1 N基板1の両面に、図7に示す ように実施例と同じTi(1000Å)/Pt(3000Å)/ Au(2000Å)をスパッタ法によりコーティングしてメ タライズ層2を形成し、次に図8に示すようにダイサー にて一辺1.0mmの方形にカットしてサブマウントを作っ

た後、図9に示すようにヒートシンク4の表面にAuS n 20wt%の半田にてボンディングし、サブマウントの表 面にAuSn20wt%の半田にてレーザー発振索子3をボ ンディングし、然る後図10に示すようにレーザー発振素 子3側のAlN基板1のメタライズ層2とヒートシンク 4の表面に直径50μmのAuワイヤー5をボンディング して導通をとった。

【0009】然してこれら各々100個の半導体レーザー のサブマウントの上面とヒートシンクの上面の位置で抵 抗値を測定した処、従来例のものは平均抵抗値が 0.1Ω でAuワイヤー5が断線する導通破壊が2個もあったの に対し、実施例のものは、平均抵抗値が0.06Ωで導通破 壊は皆無であった。

[0010]

【発明の効果】以上の通り本発明の半導体レーザーのサ ブマウントは、スルホールを設け、このスルホールの内 面にメタライズ層を形成して、両面のレーザー発振素子 とヒートシンクの導通をとっているので、従来のような ワイヤーによるボンディングは不要であり、またバレル コーティングも必要がなく、組立時の工数が削減され、 ワイヤー断線による導通不良が解消される。また加工工 程上、最終工程でダイシングカットを行うこととなるの で、最後までAlN基板の状態で取り扱うことができ、 品質、性能の安定したものを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体レーザーのサブマウントの一実 施例の製作工程を示す図である。

【図2】本発明の半導体レーザーのサブマウントの一実 施例の製作工程を示す図である。

【図3】本発明の半導体レーザーのサブマウントの一実 30 7 施例の製作工程を示す図である。

【図4】本発明の半導体レーザーのサブマウントの一実 施例の製作工程を示す図である。

【図5】本発明の半導体レーザーのサブマウントの一実 施例の製作工程を示す図である。

【図6】従来の半導体レーザーのサブマウントの一例の 製作工程を示す図である。

【図7】従来の半導体レーザーのサブマウントの一例の 製作工程を示す図である。

【図8】従来の半導体レーザーのサブマウントの一例の 製作工程を示す図である。

【図9】従来の半導体レーザーのサブマウントの一例の 製作工程を示す図である。

【図10】従来の半導体レーザーのサブマウントの一例の 製作工程を示す図である。

【図11】従来の半導体レーザーのサブマウントの他の例 の製作工程を示す図である。

【図12】従来の半導体レーザーのサブマウントの他の例 の製作工程を示す図である。

【図13】従来の半導体レーザーのサブマウントの他の例 の製作工程を示す図である。

【図14】従来の半導体レーザーのサブマウントの他の例 の製作工程を示す図である。

【符号の説明】

AlN基板

2 A1N基板の上下両面及びスルホール内面のメタラ イズ層

3 レーザー発振素子

ヒートシンク

スルホール

サブマウント

